

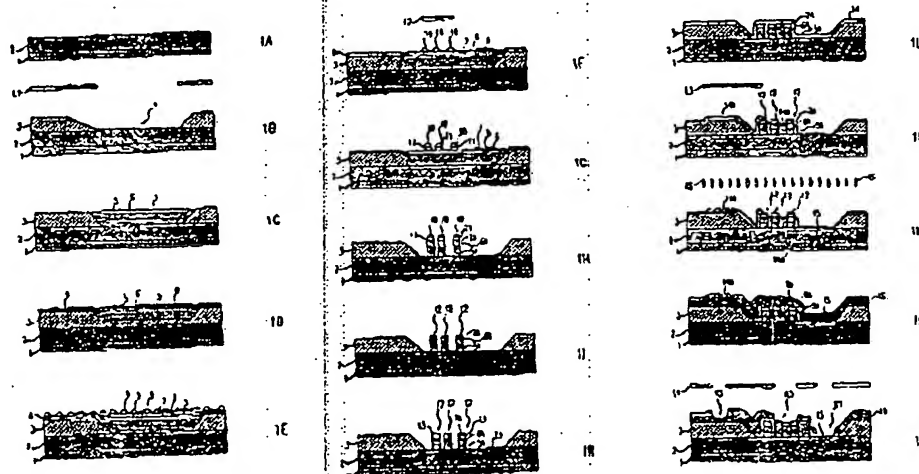
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. Januar 2001 (25.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/06542 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation: H01L (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ, Thomas
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02316 (DE/DE); Annette Kolb Anger 13/V, 81737 München
(DE); RÖSNER, Wolfgang (DE/DE); Heinzelmännchen-
(22) Internationales Anmeldedatum: 17. Juli 2000 (17.07.2000) str. 2, 81739 München (DE); FRANOSCH, Martin
(DE/DE); Helmut-Küntner-Str. 27, 81739 München (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch SCHÄFER, Herbert (DE/DE); Lerchenstr. 33, 85635
Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE); RISCHE, Lothar
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (DE/DE); Annette Kolb Anger 13/V, 81739 München
(DE); AUGLE, Thomas (DE/DE); Albert-Schweitzer-Str.
38, 81735 München (DE).
- (30) Angaben zur Priorität: 199 33 564.8 16. Juli 1999 (16.07.1999) DE (74) Gemeldeter Vertreter: INFINEON TECHNOLO-
GIES AG; Zedlitz, Peter, Postfach 22 13 17, 80503
München (DE).
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE/DE); St.-
Martin-Str. 53, 81541 München (DE). (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A VERTICAL SEMICONDUCTOR TRANSISTOR COMPONENT ELEMENT AND
A VERTICAL SEMICONDUCTOR TRANSISTOR COMPONENT(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTIKAL-HALBLEITERTRANSISTORBAUELEMENTS
UND VERTIKAL-HALBLEITERTRANSISTORBAUELEMENT

(57) Abstract: According to the invention, a double gate MOSFET semiconductor layer structure is formed on a substrate (1). This structure is comprised of a first and of a second gate electrode (10A, 10B) between which a semiconductor channel layer zone (4A) is embedded, and of a source region (2A) and a drain region (2B) which are arranged on opposite faces of the semiconductor channel layer zone (4A). At least one additional semiconductor channel layer zone (6A) is provided on one of the gate electrodes (10B). The faces of the at least one additional semiconductor channel layer zone are also contacted by the source region (2A) and drain region (2B).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/06542 A2

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. Januar 2001 (25.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/06542 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/336, 21/335, 29/76

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81541 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02316

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Juli 2000 (17.07.2000)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ, Thomas
[DE/DE]; Annette Kolb Anger 13/V, 81737 München
(DE). RÖSNER, Wolfgang [DE/DE]; Heinzelmännchen-
str. 2, 81739 München (DE). FRANOSCH, Martin
[DE/DE]; Helmut-Käutner-Str. 27, 81739 München (DE).
SCHÄFER, Herbert [DE/DE]; Lerchenstr. 33, 85635
Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE). RISCH, Lothar
[DE/DE]; Annette Kolb Anger 13V, 81739 München
(DE). ÄUGLE, Thomas [DE/DE]; Albert-Schweitzer-Str.
38, 81735 München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

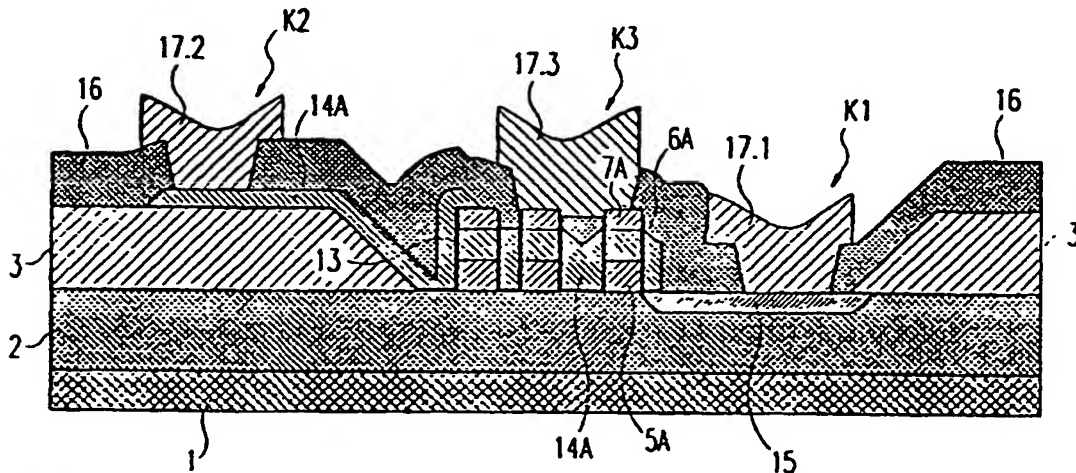
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
199 33 564.8 16. Juli 1999 (16.07.1999) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A VERTICAL SEMICONDUCTOR TRANSISTOR COMPONENT ELEMENT AND
A VERTICAL SEMICONDUCTOR TRANSISTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTIKAL-HALBLEITERTRANSISTORBAUELEMENTS
UND VERTIKAL-HALBLEITERTRANSISTORBAUELEMENT



(57) Abstract: According to the invention, a double gate MOSFET semiconductor layer structure is formed on a substrate (1). This structure is comprised of a first and of a second gate electrode (10A, 10B) between which a semiconductor channel layer zone (4A) is embedded, and of a source region (2A) and a drain region (2B) which are arranged on opposite faces of the semiconductor channel layer zone (4A). At least one additional semiconductor channel layer zone (6A) is provided on one of the gate electrodes (10B). The faces of the at least one additional semiconductor channel layer zone are also contacted by the source region (2A) and drain region (2B).

(57) Zusammenfassung: Auf einem Substrat (1) ist eine Doppel-Gate-MOSFET-Halbleiterschichtstruktur aufgebaut. Diese besteht aus einer ersten und einer zweiten Gateelektrode (10A, 10B), zwischen denen eine Halbleiter-Kanalschichtzone (4A) eingebettet ist, sowie einem Source- (2A) und Drain-Bereich (2B), welche an gegenüberliegenden Stirnseiten der Halbleiter-Kanalschichtzone (4A) angeordnet sind. An einer der Gateelektroden (10B) ist zumindest eine weitere Halbleiter-Kanalschichtzone (6A) vorgesehen, deren Stirnseiten ebenfalls von dem Source- (2A) und Drain-Bereichen (2B) kontaktiert sind.

WO 01/06542 A3